

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

「テスト・フロア・インテリジェンス」の最新版を発表

ビッグデータ処理技術で、半導体テスト効率がさらに進化

株式会社アドバンテスト(本社：東京都千代田区 社長：松野晴夫)は、ソフトウェア・ソリューション「テスト・フロア・インテリジェンス」の最新版(以下「TFI2.0」)を発表しました。「TFI2.0」は、半導体試験の過程で生じる大容量データを抽出・解析する技術により、テスト工程における総合設備効率(OEE)をさらに高めます。大規模のファブレス、OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test)、ファウンドリをターゲットとし、2013年7月に販売を開始します。

半導体試験工程では、総合設備効率向上のため、豊富なテスト・データを活用し、テスト・システムの稼働率やテストタイム、メンテナンス・サイクルや歩留まりを改善することが求められています。「TFI2.0」は、1台のサーバに接続されたアドバンテスト製テスト・システムを対象に、統合データを収集しレポートすることを可能にしました。ユーザは、システムの稼働率、不具合、歩留まりなど、テスト効率に関わる重要な情報を瞬時に解析することができます。また、生産性に大きく影響するテストプログラム、インタフェース、システム上の潜在的な問題を事前に特定します。

「TFI2.0」のソフトウェア・パッケージは、リアルタイムにシステムの状態、メンテナンス記録、テスト・ハンドラやデバイス・インタフェースとの接続状況など、従来のデータ量をはるかに凌ぐ豊富なデータを最新の環境で利用することができます。テラバイト単位のデータ処理により、今までにないインタラクティブで柔軟性と拡張性の高いソリューションをお届けします。

半導体業界でコンサルタントを務める Ron Leckie 氏は、「テスト工程の最適化にあらゆる側面から取り組んでいる半導体メーカーや OSAT にとって、総合設備効率は最重要事項となっています。」とコメントしています。テスト・プロセス全体をモニタし制御するソフトウェア「TFI2.0」は、マルチ・サイト・テストに続く次世代のソリューションとして、総合設備効率の向上に大きく貢献します。